

# ОБЪЕМНЫЕ ФОТОПРЕВРАЩЕНИЯ В ОКРАШЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ LiF

*O. V. Колокольцев, И. Н. Халимонова*

Еще в пионерской работе [1] отмечалось, что люминесценция центров окраски (ЦО) возникает при возбуждении в  $F_2^-$ ,  $F_2^+$ - и  $F_3^-$ -полосах, что по существу осталось без объяснения. Далее авторы [2] отмечали разрушение  $F_2^-$  и  $F_3^-$  ЦО при накачке лазером с длиной волны 532 нм, а [3] — разрушение  $N$ -центров и рост  $F_2^-$ ,  $F_3^-$ , которые восстанавливаются до исходного уровня после выключения лазера накачки. Это и побудило нас повторить ряд экспериментов.

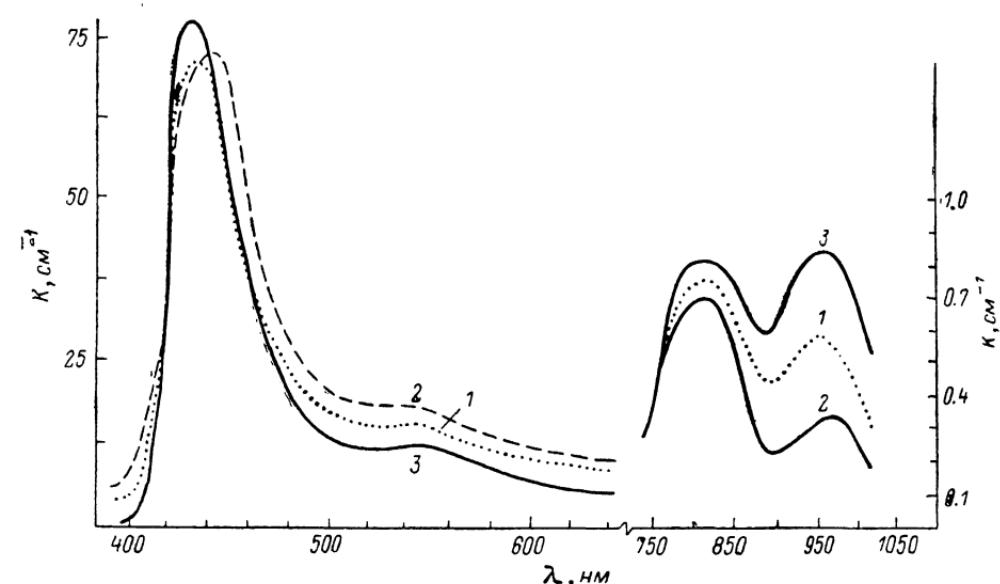


Рис. 1. Поглощение окрашенного кристалла LiF.

1 — исходная кривая; 2 — после облучения светом с длинами волн  $\lambda_1=0.96$ ,  $\lambda_2=0.63$  мкм; 3 — после облучения зеленым светом, линейно-поляризованным вдоль направления  $\langle 110 \rangle$  кристалла,  $\lambda=0.52$  мкм.

В настоящей работе проводилось облучение окрашенных кристаллов LiF вначале в полосу поглощения  $F_2^-$ -центров либо Nd-лазером ЛТН-101, либо через интерференционный светофильтр, а затем либо гелий-неоновым лазером, либо через красный светофильтр в полосу поглощения  $F_2^+$ -центров. Происходившие изменения в спектре поглощения кристалла представлены на рис. 1 (кривые 1, 2). Как видно, при этом происходит разрушение  $F_2^-$  и  $F_3^-$  ЦО, уширение и смещение в длинноволновую сторону полосы в области 450 нм, что свидетельствует о частичном преобразовании  $F_2^-$  в  $F_3^-$ -центры, а также рост поглощения в области  $F_2^+$ - и  $N$ -полос. Наиболее значительны в процентном соотношении изменения в области полосы поглощения  $F_2^-$ -центров. Отсюда следует общий вывод: разрушаются  $F_2$ ,  $F_2^-$ ,  $F_3^-$  ЦО, растет число  $F_2^+$ ,  $F_3^+$ - и  $N$ -центров. Проконтролировать изменение в полосе поглощения  $F$ -центров не удается из-за очень сильного поглощения в этой области. Отметим, что без предварительной подсветки в  $F_2^-$ -полосу поглощения описанные выше изменения не происходят.

Приведем интересные особенности процесса, которые нигде ранее не отмечались. Изменения в поглощении (рис. 1) происходят не только в облучаемой части кристалла, а по всему объему. При освещении участка

поверхности кристалла в несколько квадратных миллиметров изменение поглощения фиксируется на расстоянии в несколько сантиметров от места облучения кристалла. Эти изменения не зависят от расстояния между участками облучения и измерения в радиальном направлении, но обнаруживают азимутальную зависимость. На рис. 2 представлена такая зависимость для поглощения  $F_2^-$ -центров. Диаметр облученного пятна 1 мм, изменение поглощения фиксировалось по дуге окружности радиусом 18 мм от центра облучения. Из рис. 2 видно, что максимальное разрушение  $F_2^-$ -центров происходит в направлении  $\langle 110 \rangle$ . Эффективность преобразования центров не зависит от расстояния между облученным участком, на котором измеряется поглощение, по крайней мере на расстоянии до 4 см. Проверить однородность преобразования в большем объеме не удалось из-за отсутствия кристаллов большего размера.

При облучении этого же кристалла излучением в  $N$ -полосу ( $\lambda_{\max} = 520$  нм), поляризованным в направлении  $\langle 110 \rangle$ , в кристалле происходят обратные изменения: разрушаются  $N$ -,  $F_3^+$ - и  $F_2^+$ -центры, а поглощение  $F_2^-$  и  $F_3^-$  ЦО возрастает, при этом может превышать исходное в два

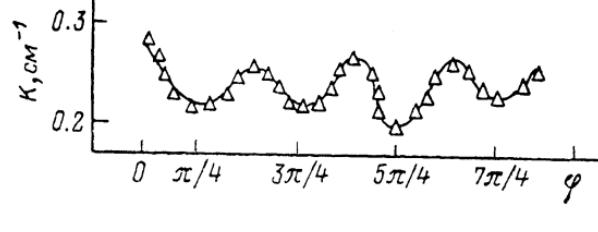


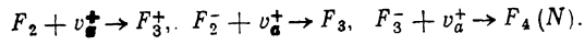
Рис. 2. Азимутальная зависимость поглощения  $F_2^-$  ЦО кристалла LiF.

раза (рис. 1, кривая 3). Здесь сохраняются обнаруженные особенности эффекта: изменения происходят во всем объеме, наблюдается азимутальная зависимость, аналогичная рис. 2, и не обнаруживается зависимость от расстояния между точками облучения и измерения в радиальном направлении.

Измерения проводились на различных кристаллах LiF, выращенных в вакууме и открытой атмосфере, окрашенных несколько месяцев назад и через несколько дней после окраски. Результаты качественно воспроизвелись на всех образцах. Это свидетельствует о том, что наблюдаемый эффект не связан с какой-либо примесью или маложивущими дефектами, имеющимися в кристалле сразу после облучения.

Для объяснения этого эффекта не подходит механизм резонансной передачи энергии от  $F_2^+$ -центров к  $F_2^-$ , хотя полоса люминесценции  $F_2^+$  ЦО перекрывается с полосой поглощения  $F_2^-$  ЦО. При таком механизме передачи возбуждения по кристаллу наблюдалась бы экспоненциальная зависимость в поглощении от расстояния до точки облучения. В наблюдаемом явлении не могут участвовать и электроны, их длина свободного пробега намного меньше. Так, в [4] показано, что при разрушении  $F_2^-$  ЦО ультрафиолетовым облучением, когда освобождаемый электрон попадает в зону проводимости, изменения поглощения происходят в приповерхностном слое кристалла глубиной менее 1 мм.

Наблюдаемая азимутальная зависимость наводит на мысль, что взаимодействие между центрами происходит преимущественно в направлении ориентированной по  $\langle 110 \rangle$  цепочки ионов фтора. Здесь можно предложить следующий механизм. Ориентированные вдоль оси  $\langle 110 \rangle$  центры  $F_2^+$  при возбуждении распадаются на  $F$ -центр и анионную вакансию. При движении последней вдоль одной из осей  $\langle 110 \rangle$  наиболее вероятна встреча с  $F$ -центром, что приведет опять же к образованию  $F_2^+$  ЦО. Но возможны и такие реакции:



Основное затруднение здесь в том, что число анионных вакансий, которое может возникнуть при распаде  $F_2^+$ -центров в облучаемой части кристалла, значительно меньше, чем число преобразованных центров по всему объему. Кроме того, остается неясной роль предварительной подсветки в область поглощения  $F_2^-$ -центров. В рамках такой модели не представляется возможным объяснить обратный эффект при подсветке в область  $N$ -полосы. Модель, которую можно предложить для обсуждения, основана на следующей гипотезе. При релаксации возбужденный  $F_2^-$ -центр может попадать в состояние с возбужденным локальным колебанием этого центра, обладающим большим временем жизни. В свою очередь возбуждение  $F_2^+$ -центра вызывает колебания анионной подрешетки того же типа симметрии, так как и  $F_2^-$ - и  $F_2^+$ -центры занимают два соседних анионных узла, ориентированных вдоль оси  $\langle 110 \rangle$ . Вероятно, такое сочетание возбуждений приводит к рождению динамических краудионов, движущихся по анионной цепочке. Отсутствие литературных данных о численных значениях частот локальных колебаний агрегатных центров в кристалле LiF не позволяет обсудить это предположение более подробно, хотя в литературе есть сведения о том, что краудионная волна может двигаться сквозь кристалл как свободная частица [5].

Очевидно, что аналогичные изменения можно наблюдать и в кристалле NaF, где температура Дебая также значительно выше комнатной. Аналогичные условия существования динамических краудионов в других кристаллах можно получить только при пониженной температуре, т. е. в криостате, где наблюдение объемных эффектов затруднено.

#### Список литературы

- [1] Nahum J. // Phys. Rev. 1967. V. 158. N 3. P. 814–825.
- [2] Smith K., Sibbett W., Taylor J. D. // Opt. Comm. 1984. V. 50. N 4. P. 330–334.
- [3] Иванов Н. А., Лохныгин В. Д., Фомичев А. А. и др. // ЖПС. 1987. Т. 46. № 2. С. 207–211.
- [4] Михнов С. А., Страцкевич Л. И., Хюнценек В. П., Шкадаревич А. П. // ЖПС. 1983. Т. 39. С. 552–556.
- [5] Коссевич А. М. Теория кристаллической решетки. Харьков, 1988.

Киевский государственный университет  
им. Т. Г. Шевченко  
Киев

Поступило в Редакцию  
25 июля 1989 г.

УДК 535.55

© Физика твердого тела, том 32, № 2, 1990  
*Solid State Physics, vol. 32, N 2, 1990*

#### ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ ОДНООСНО СЖАТЫХ КРИСТАЛЛОВ $\text{AgGaS}_2$

Л. М. Сусликов, Ю. А. Хазитарханов, З. П. Гадъмаш, Д. Ш. Ковач, В. Ю. Сливка

В настоящей работе исследуется влияние одноосного сжатия различного направления на двулучепреломление  $\Delta n(\lambda)$  монокристаллов  $\text{AgGaS}_2$ . Такие данные в литературе отсутствуют. Вместе с тем они дают возможность понять механизм трансформации зонной структуры кристалла под влиянием внешних воздействий и определить устойчивость к последним физических параметров кристалла. Исследования проводились при двух ориентациях давления  $P$  относительно оптической оси кристалла:  $P \parallel C$  ( $P \parallel [001]$ ) и  $P \perp C$  ( $P \parallel [010]$ ). Излучение распространялось в направлении  $[100]$ . Измерения проводились при комнатной температуре, интервал изменения давления составлял  $0–14 \cdot 10^6$  Па. Метод